

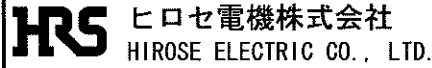
TO
PCK

△の数		訂正記事	担当	検図	年月日	△の数		訂正記事	担当	検図	年月日
△	2	RE-F-09653	中村	山口	04.04.06	△					
△	1	RE-F-10251	土井	小沢	05.02.02	△					

適用規格				
定 格	使用温度範囲	-55℃ ~ 85℃	保存温度範囲	-10℃ ~ 60℃ (注3)
	電 圧	AC 100 V	使用湿度範囲	40 % ~ 80 %
	電 流	0.4 A	保存湿度範囲	40 % ~ 70 % (注3)

性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	80 mΩ以下 (注1)	○	—
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。	100 mΩ以下 (注2)	○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 (0.7×極数) N以下 引抜力 (0.065×極数) N以上	○	—
	繰返し動作	50 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10 ~ 55 Hz, 振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2) ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上	○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ 2~3 → 30→ 2~3 分 を 5 サイクル試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗: 100 mΩ以下 (注2)	○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)	② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内	外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。	○	—
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内		○	—
はんだ付け性	① はんだ温度 240±3℃, 浸せき時間 ② 3 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—	

備考		製 図	担 当	検 図	承 認	出 図
注1. 本製品のスタッキング高さ16mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の初期値を80mΩとする。 注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。 注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。						

注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		
		製品名 FX8C-※※S-SV (93)
旧CL	図番	製品コード
CL	SLC4-151022-23	CL578

